

[図1]

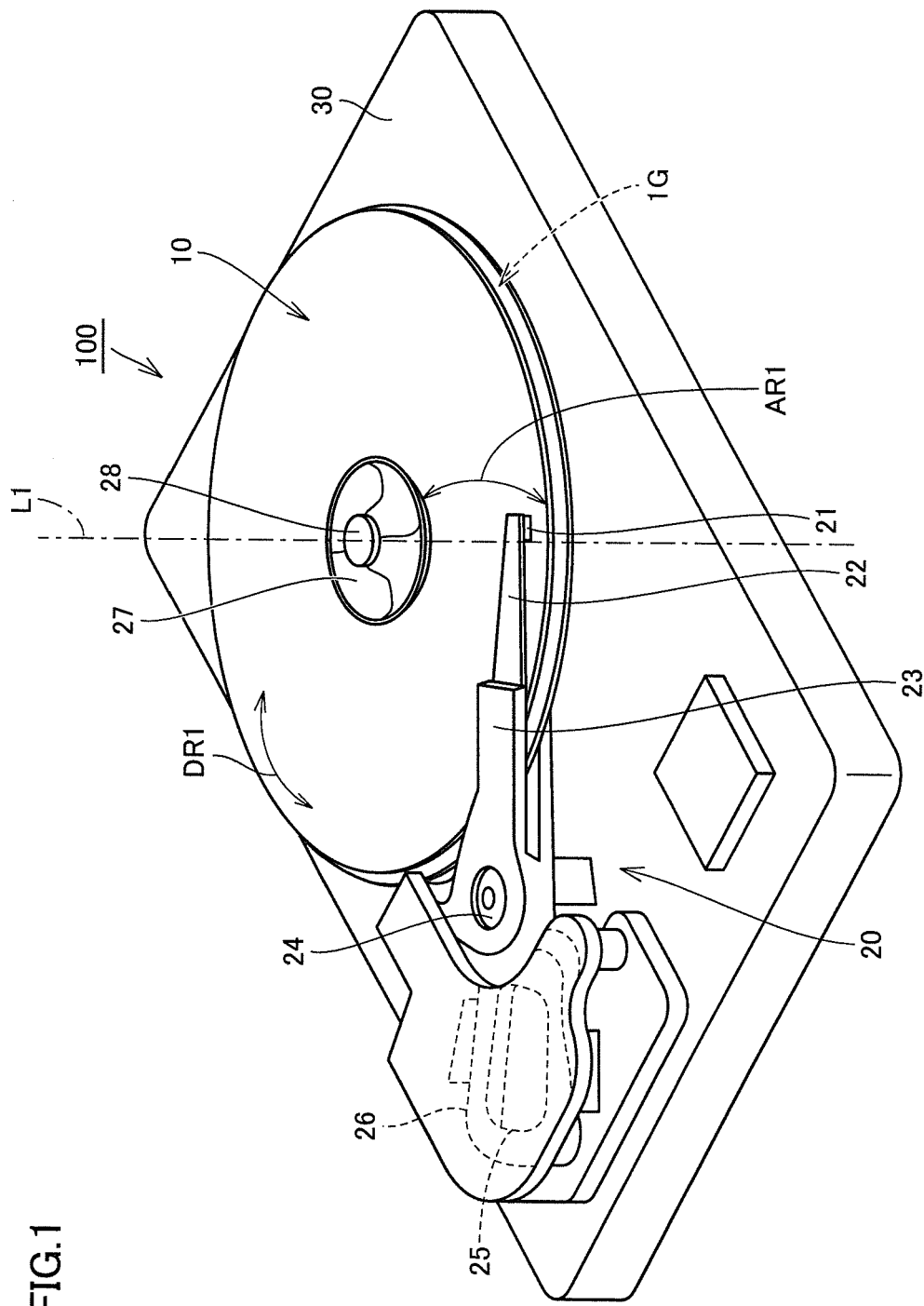
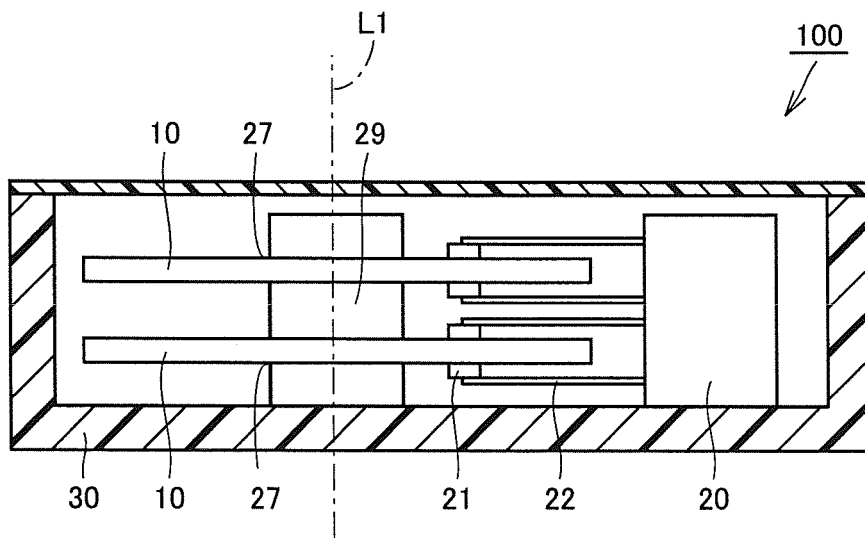


FIG.1

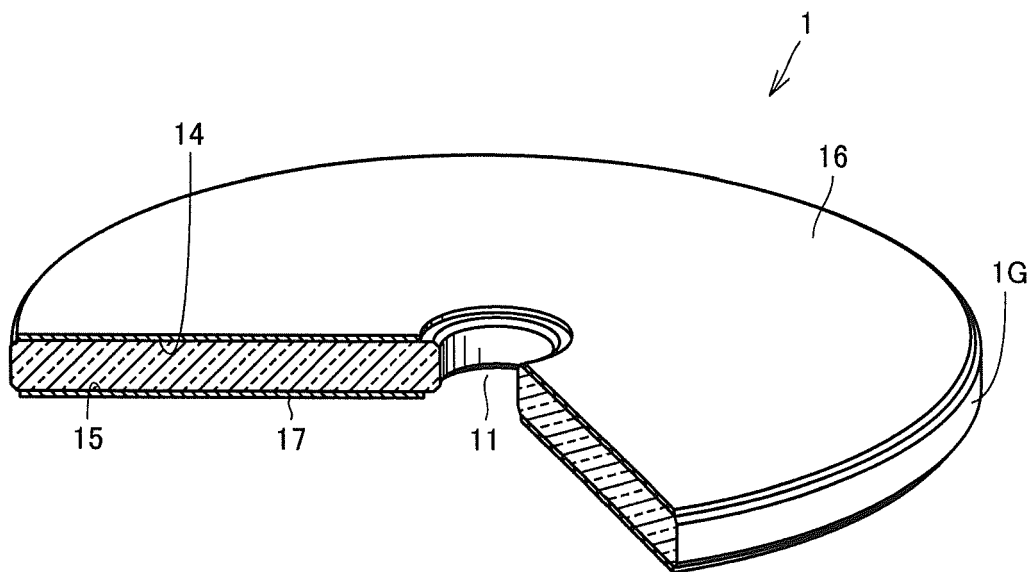
[図2]

FIG.2



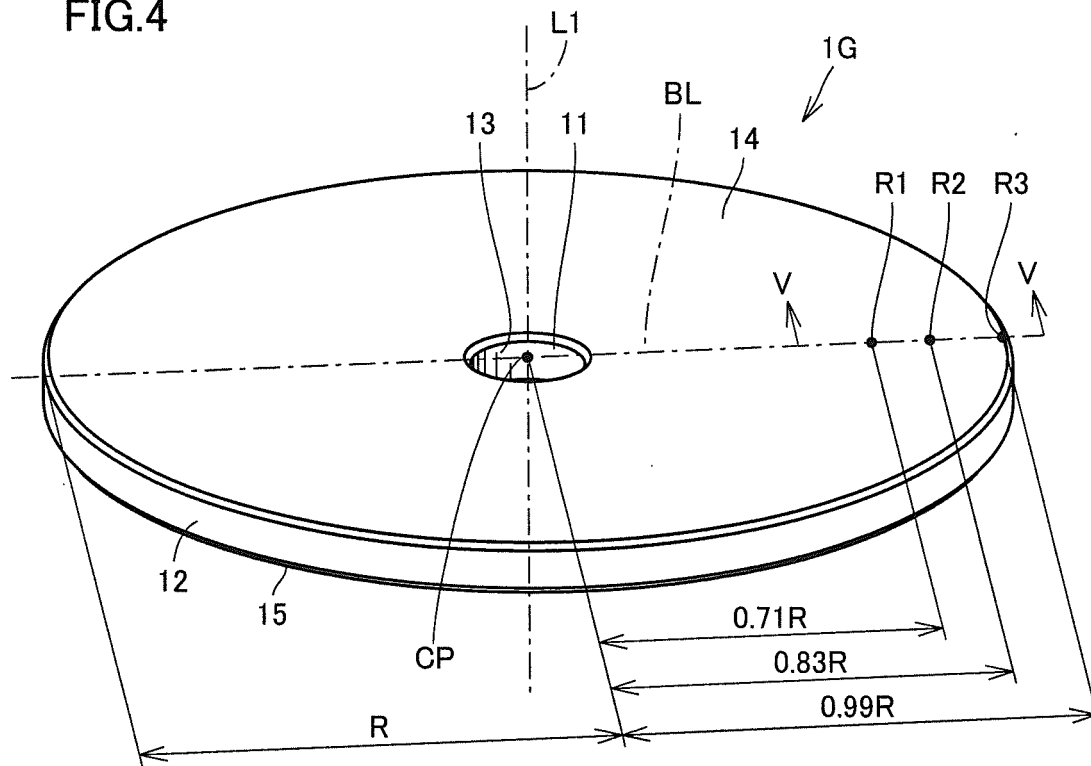
[図3]

FIG.3



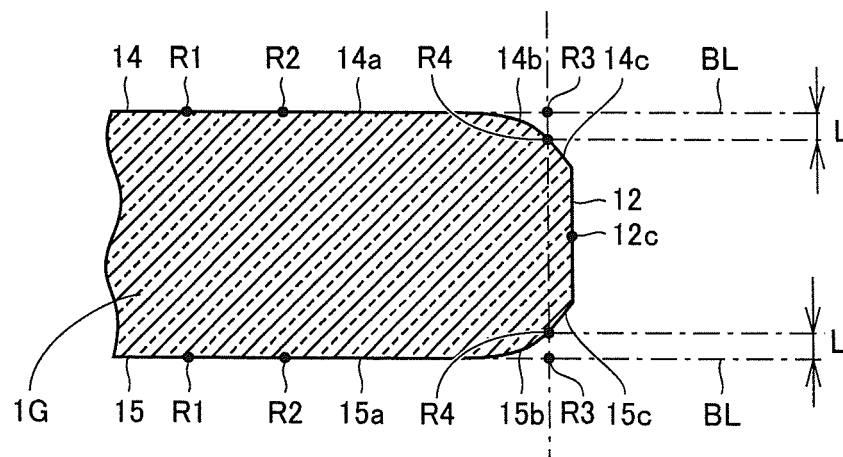
[図4]

FIG.4



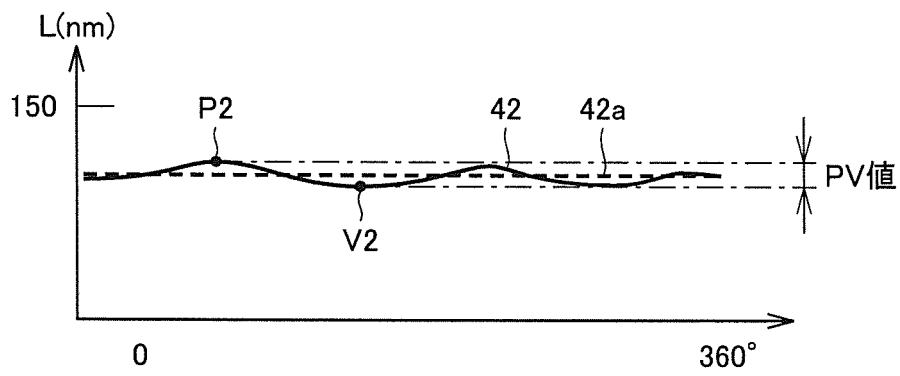
[図5]

FIG.5



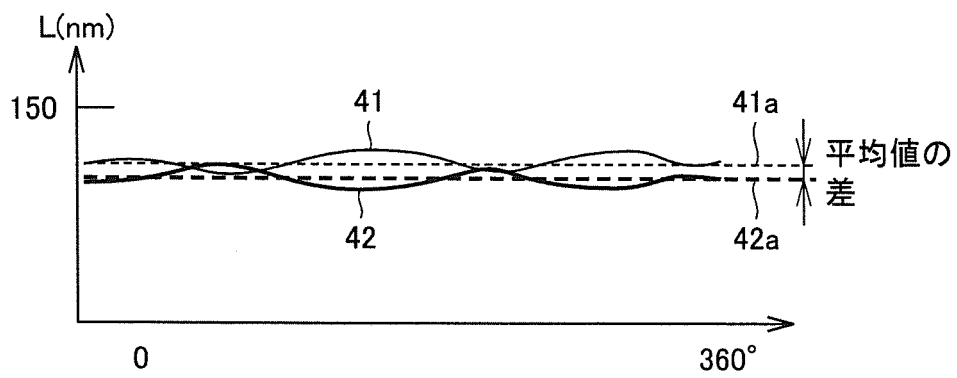
[図6]

FIG.6



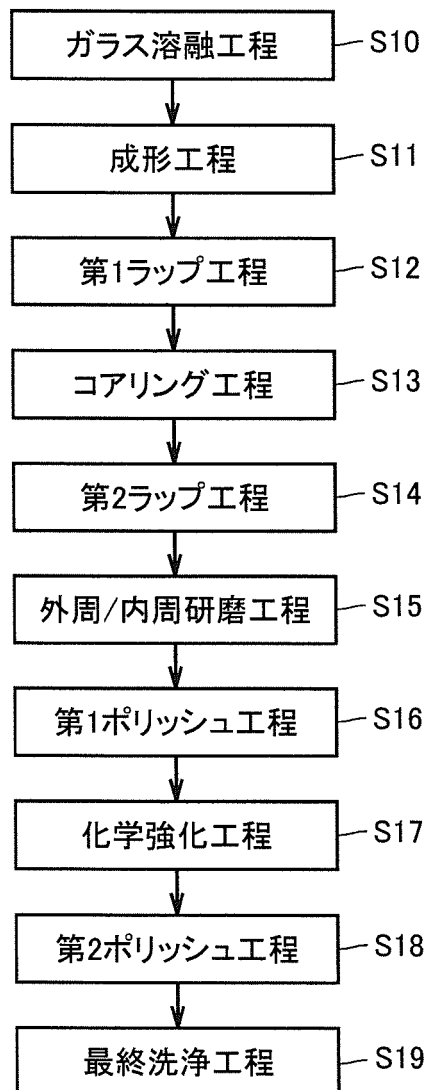
[図7]

FIG.7



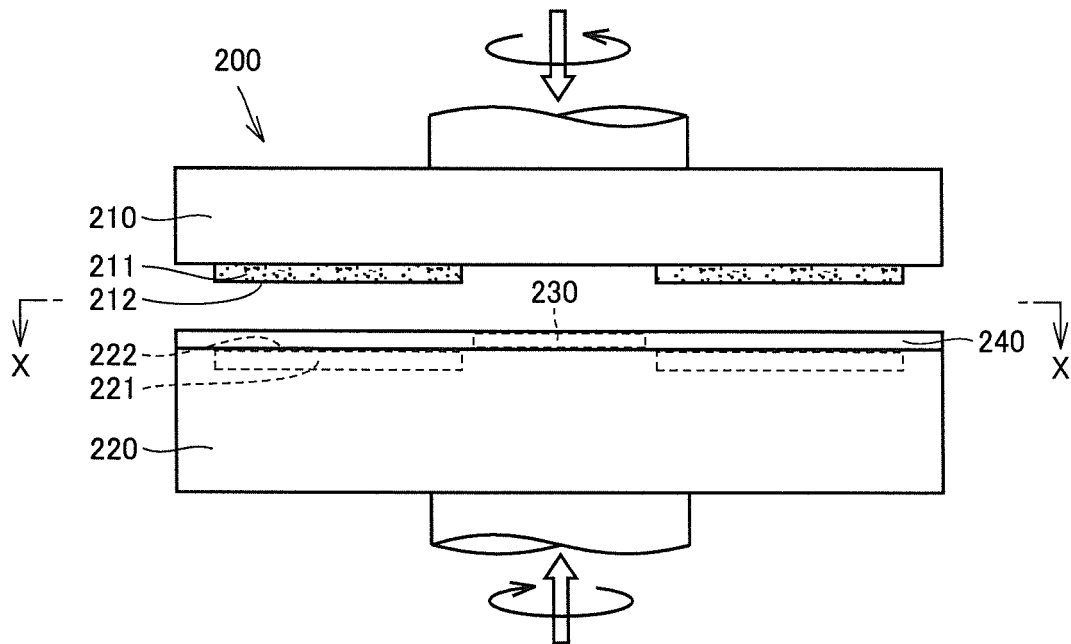
[図8]

FIG.8



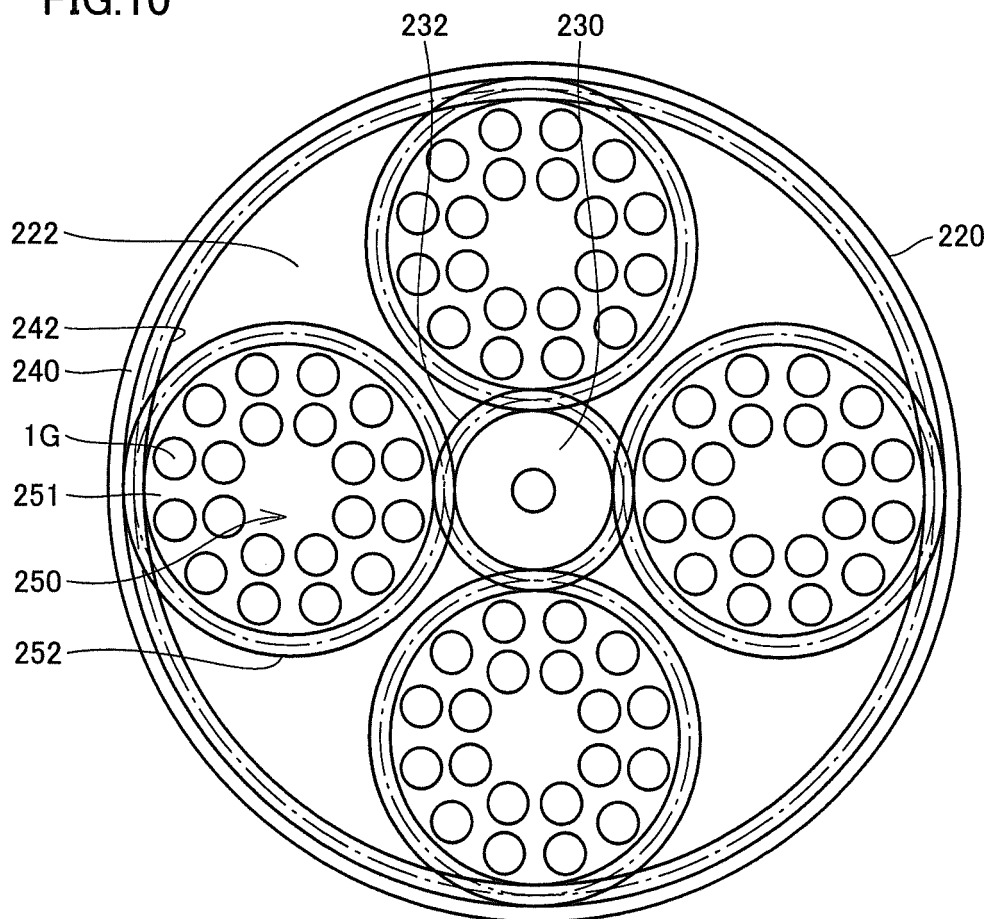
[図9]

FIG.9



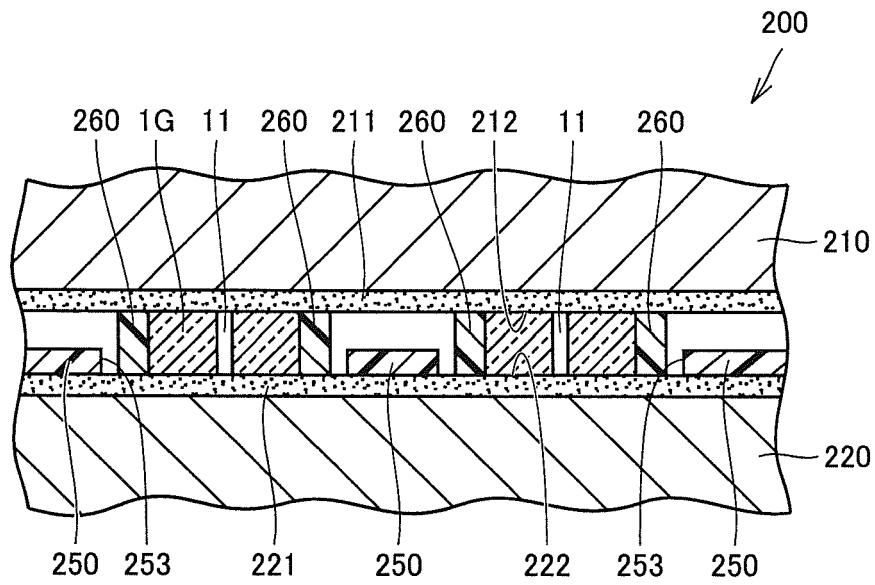
[図10]

FIG.10



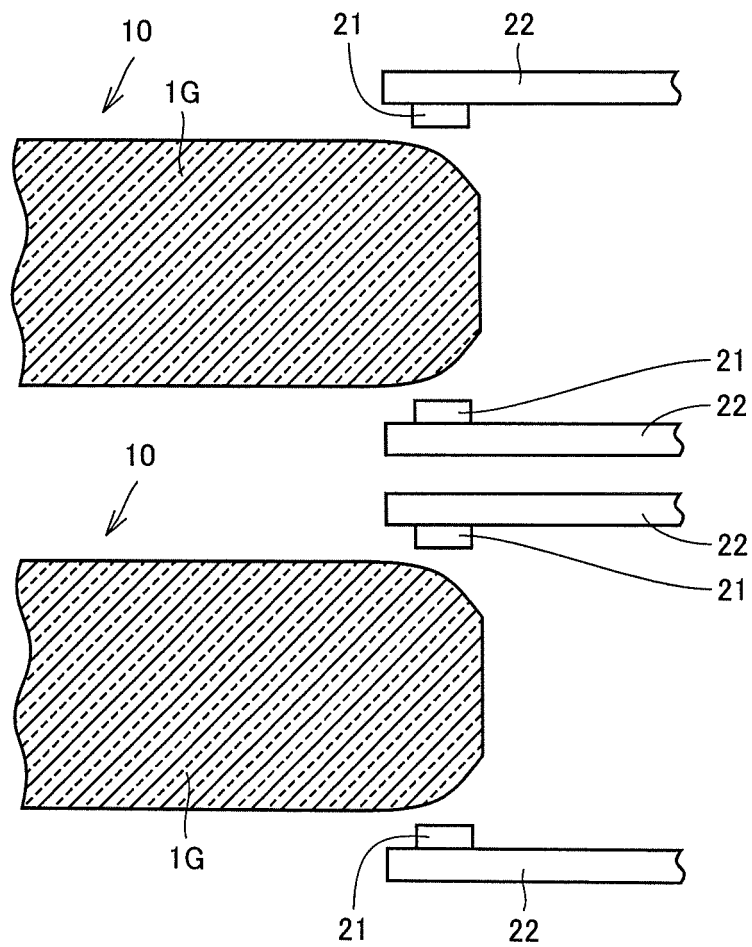
[図11]

FIG.11



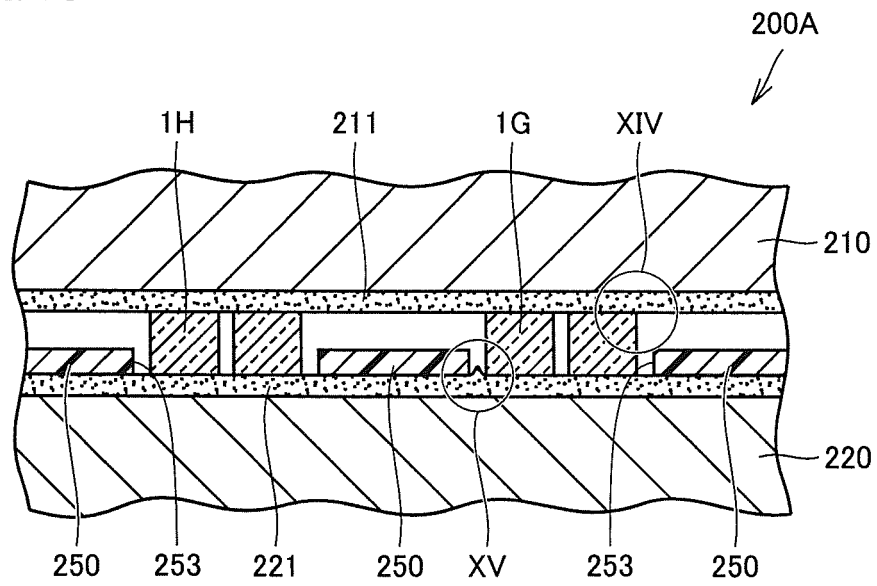
[図12]

FIG.12



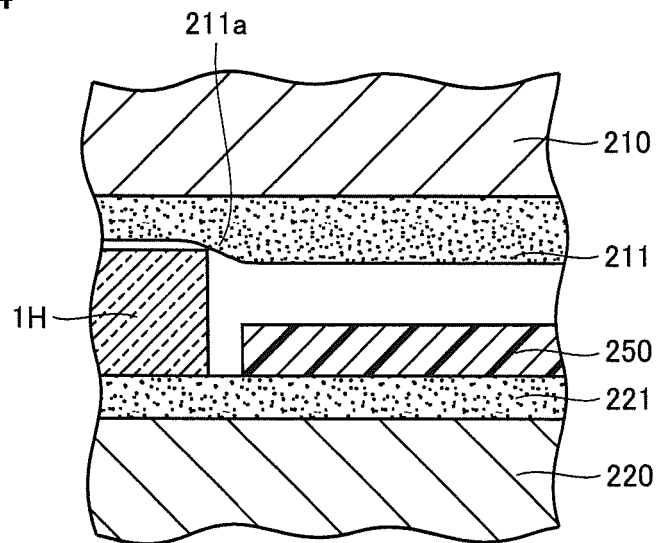
[図13]

FIG.13



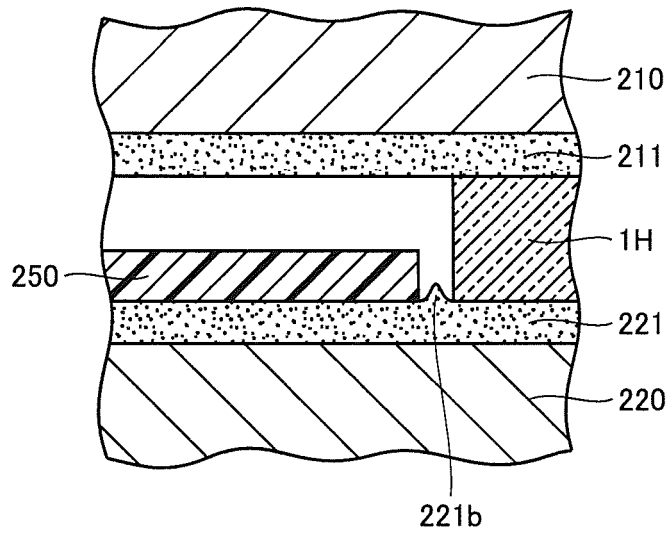
[図14]

FIG.14



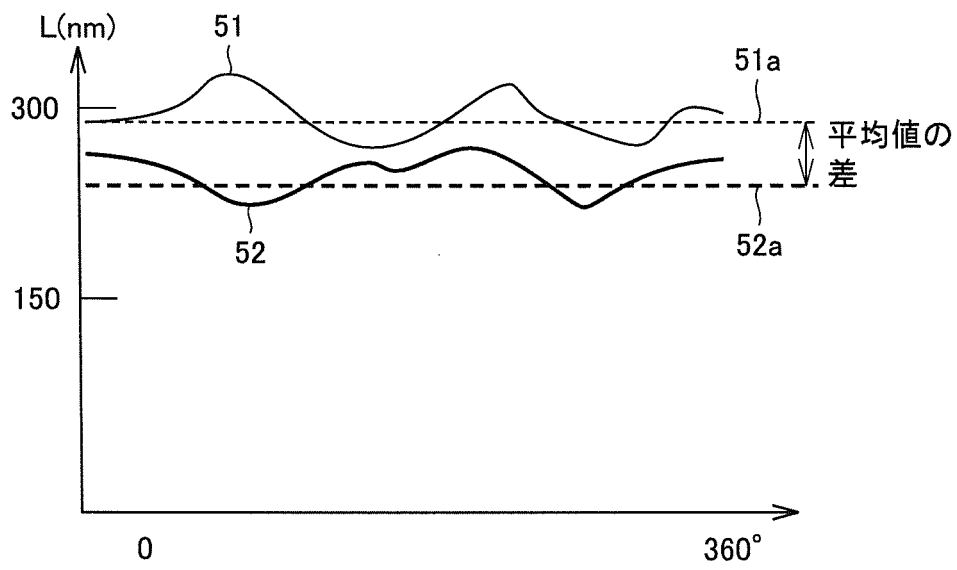
[図15]

FIG.15



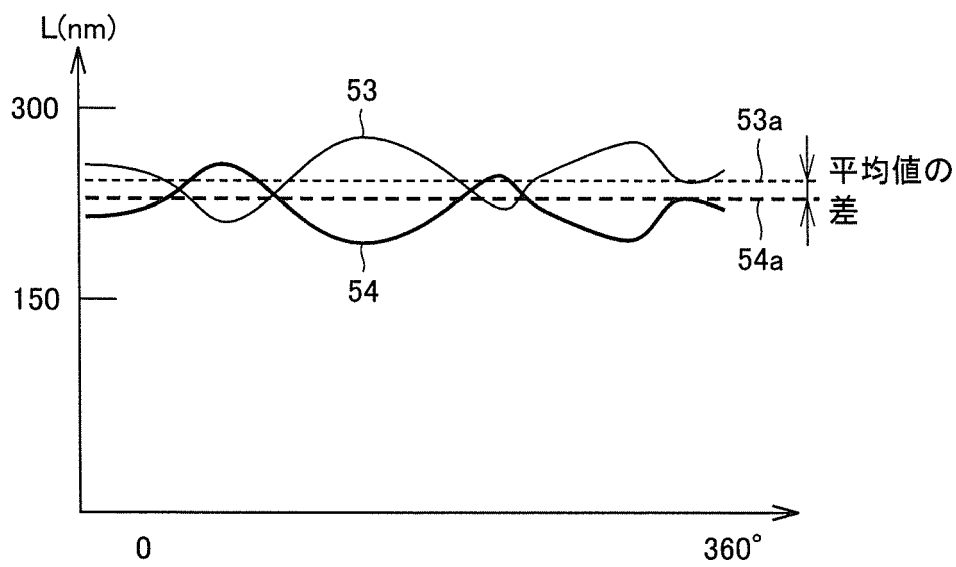
[図16]

FIG.16



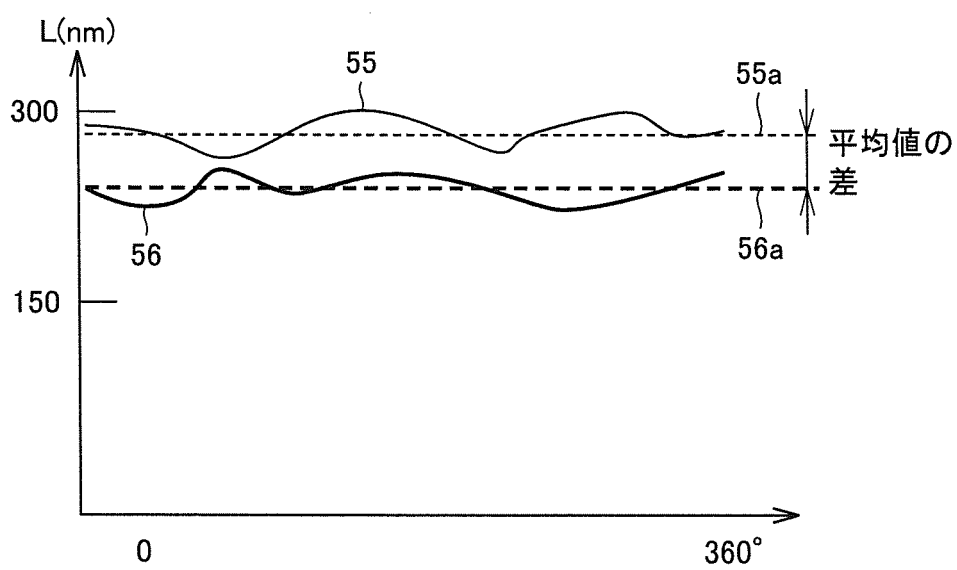
[図17]

FIG.17



[図18]

FIG.18



[図19]

FIG.19

※基板の厚さ0.8mm

	PV値 (nm)	表側におけるずれ量の分布が 有する平均値と裏側における ずれ量の分布が有する平均値 との差	ロードアンロード試験		
			5400rpm	7200rpm	
比較例1	60	30	120万回でエラー発生	100万回でエラー発生	不可
比較例2	60	10	380万回でエラー発生	210万回でエラー発生	不可
比較例3	40	30	400万回でエラー発生	390万回でエラー発生	不可
実施例1	40	10	500万回でもエラー無し	500万回でもエラー無し	可
実施例2	30	5	500万回を2回行なっても エラー無し	500万回を2回行なっても エラー無し	良

[図20]

FIG.20

※基板の厚さ0.65mm

	PV値 (nm)	表側におけるずれ量の分布が有する平均値と裏側におけるずれ量の分布が有する平均値との差	ロードアンロード試験	
			5400rpm	
比較例1	60	30	90万回でエラー発生	不可
比較例2	60	10	190万回でエラー発生	不可
比較例3	40	30	380万回でエラー発生	不可
実施例1	40	10	500万回でもエラー無し	可
実施例2	30	5	500万回を2回行なってもエラー無し	良